

TIDAS MSP 系统适用范围：

- 在透射模式下可以测量光纤的紫外/可见光光谱
- 关于反射率（明/暗场）所有应用程序，偏振或荧光，取决于所选择的配置
- 获取时间小于1秒
- 通过J&M TidasVISION软件在线视频图像和光谱的同步采集
- 灵活可调的控光装置
- 灵活运用于材料学和生物学(MSP 400/800)
- 光电倍增器或 CCD 探测器
- 可适应不同制造商的显微镜

概述

有机发光二极管（OLED）正在开发的下一代显示器和光源。TIDAS J&M MSP400/800显微分光光度计在OLED/TFT/LED研究领域广泛，目的是衡量和比较的光谱输出，每个常用的OLED器件的微观像素的亮度和颜色的一致性。

有机发光二极管（OLED）有一个发光的电致发光层，在支持矩阵有机分子组成。显示，这层是形成有序的行列数以百万计的微观像素。由于不同的有机物是用来产生不同的颜色，与不同的有机化合物像素可以产生全彩色，高分辨率显示的不同颜色。OLED显示单元，不像传统的液晶显示器（LCD），最大的优点是像素结合光源和颜色源。这意味着，OLED显示屏更轻更薄，比一个液晶显示屏，使用更少的电力。然而，强度和颜色的光发射器件上的一致性至关重要。这是TIDAS J&M MSP400/800分光光度计得到使用的关键。

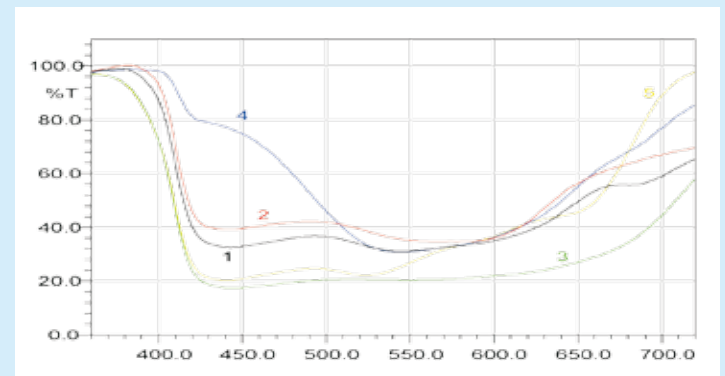
TIDAS J&M MSP400/800是一种附加在显微镜上的分光光度计。它允许用户获取的图像和微观样本地区迅速，并迅速获得的光谱。当添加到适当的显微镜或探针台，TIDAS J&M MSP400/800可以用来衡量一个OLED显示屏的每个像素的颜色和强度。像素可以进行比较的强度和色彩的一致性或地图，可为每个设备生成。如TIDAS J&M MSP400/800可以获得几毫秒的时间顺序上的光谱仪器，整个OLED显示器可以快速，准确地映射。这将确保色彩和整个装置的强度，以及从设备到设备的一致性。以及在平板显示器领域，用来检查红、绿、蓝点阵的薄膜厚度和杂质水平。

同时TIDAS J&M MSP400/800在半导体工业领域，可以用来发现能发荧光的微小污染物，以及在硅片被切成芯片前测量硅衬底上薄膜的厚度。J&M 公司已在欧洲、美国、南非和亚洲安装了许多系统。

TIDAS MSP 400

使用J&M的TIDAS MSP 400 你可测量在透射模式下光纤的 VIS 光谱和在反射模式下（明场和暗场）光纤与涂料的VIS光谱。光谱仪的波长范围是360 nm到780 nm。对于偏振实验，补偿的偏光板可嵌入到光纤束中。偏振光谱受限于光学显微镜，从450 nm到700 nm。在反射模式下，光谱范围为360 nm到780 nm。荧光测量和多套滤光器都是可用的（紫外光，蓝光和绿光激励是正常标准）。此外，快速扫描的单色光源（260 nm到680 nm）也是可用的。全光谱（240 nm到900 nm）通常可在小于1秒内获取。噪声和采集速度取决于所选择的领域，由灵活可调测量隔膜给出。使用40X物体时，最小光斑区域是2 μ m到2 μ m的。如果显微镜提供紫外光能力，MSP 400可升级到MSP 800。

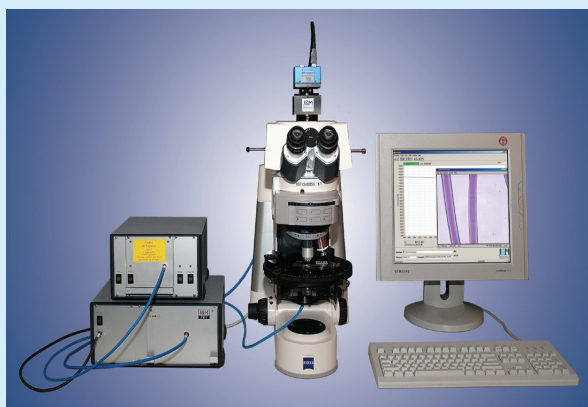
样品光谱（圆珠笔检验）



软件和配件

J&M 的软件可方便仪器的控制。附加可用的软件包提供数据处理、文档编制、导出选项和存储的多种功能。您可以创建你自己的谱库为有效的库搜索。该仪器采用了CIE色彩评估体系，并能够产生互补的色度坐标值（CCC 认证）。波长和光度计的精度可通过灰色或软滤波器实现简易的检查，这作为配件。

MSP 400 与 Zeiss (蔡司) 显微镜



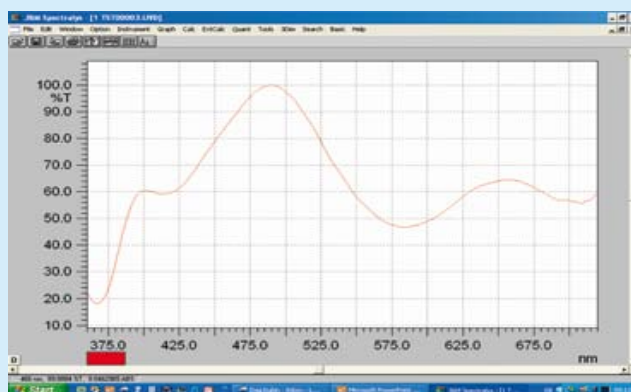
MSP 400 和 Leica (莱卡) 显微镜



汽车现代化的效果涂料摄影图片



样品光谱



应用

- 在VIS 范围检验纤维
- 在 VIS 范围分析微粒
- 文件归属人
- TFT显示器的质量控制
- LED的分析

视频成像

在线视频影像和数据的同步采集是该仪器的亮点。可灵活调节的测量膜片标记你感兴趣的样本图像区域。